

08 июня 2021 г.

Открытие конференции

- 10.30-11.00 (30 мин.) **К.И. Таперо** – *Председатель Программного комитета*
АО «НИИП»
- А.В. Яненко** – *Зам. председателя Программного комитета*
АО «ЭНПО СПЭЛС»
- В.Ф. Герасимов**
ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России

Устные доклады

1. 11.00-11.15 (15 мин.) **А.А. Смолин, А.В. Согоян, А.И. Чумаков**
АО «ЭНПО СПЭЛС», НИЯУ МИФИ
Особенности задания и оценки соответствия ИС требованиям к стойкости к воздействию ТЗЧ по одиночным радиационным эффектам
2. 11.20-11.35 (15 мин.) **Г.А. Протопопов, А.Е. Козюков, Д.А. Казанцев, П.А. Чубунов**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Особенности задания требований по стойкости к воздействию ИИ КП по дозовым эффектам
3. 11.40-11.55 (15 мин.) **А.С. Петров, В.В. Емельянов, А.А. Потей, М.В. Баньковский, М.В. Назаренко, В.М. Олухов**
АО «НИИП»
Особенности учета формы и длительности импульса моделирующих установок при определении уровней бессбойной работы
4. 12.00-12.15 (15 мин.) **Д.И. Сотсков, В.В. Елесин, Н.А. Усачев, А.Г. Кузнецов, Г.В. Чуков**
АО «ЭНПО СПЭЛС», НИЯУ МИФИ
Контрактное производство ЭКБ твердотельной СВЧ электроники в режиме «foundry»: текущее состояние, проблемные вопросы и тенденции развития
- 12.20-12.30 (10 мин.) **Обзор постерной сессии**

12.30-13.00 Перерыв (кофе-брейк)

13.00-14.00 ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ

5. 14.00-14.15 (15 мин.) **А.И. Кононенко, А.Г. Циканин**
АО «НИИП»
Управление старением электрических кабелей на атомных станциях
6. 14.20-14.35 (15 мин.) **А.И. Абрамов, Д.И. Иващенко, В.В. Кочергин, Т.Б. Мавлюдов, И.В. Сазонова**
АО «НИИП»
Установка импульсного электромагнитного поля: возможности и перспективы
7. 14.40-14.55 (15 мин.) **Ю.Ф. Жильникова, А.Д. Шорыгина, А.С. Ватуев, А.И. Озеров, В.В. Емельянов**
АО «НИИП»
Опыт использования лазерной установки PULSYS-RAD для исследований и испытаний ЭКБ на стойкость к воздействию ТЗЧ
8. 15.00-15.15 (15 мин.) **С.Л. Эльяш, Т.В. Лойко, А.Л. Юрьев, А.А. Селезнев**
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Регистрация субнаносекундных импульсов электронного и рентгеновского излучений

15.20-16.00 Перерыв (кофе-брейк)

9. 16.00-16.15 (15 мин.) **Д.В. Бобровский, А.А. Печенкин, А.И. Чумаков, Т.В. Кулевой, Ю.Е. Титаренко, Е.М. Сыресин, А.Р. Сливин, Г.А. Филатов, А.В. Бутенко**
АО «ЭНПО СПЭЛС», ОИЯИ, ИТЭФ
Стенд облучения ЭКБ длиннопробежными ионами: состояние дел и ближайшие планы
10. 16.20-16.35 (15 мин.) **П.А. Чубунов¹, А.С. Бычков¹, С.В. Митрофанов²**
¹Филиал АО «ОРКК» – «НИИ КП», ²ОИЯИ
Режим средних энергий на испытательном стенде контроля стойкости ЭКБ к воздействию ТЗЧ
11. 16.40-16.55 (15 мин.) **В.С. Першенков, В.В. Беляков, А.В. Телец, В.А. Фелицын, А.С. Бакеренков, А.С. Родин**
НИЯУ МИФИ
История развития исследований эффекта низкой интенсивности в биполярных приборах

09 июня 2021 г.

12. 10.30-10.45 (15 мин.) **Т.Ш. Комбаев**
АО «НПО им. С.А. Лавочкина»
Методика адаптации САД моделей КА для радиационных расчетов в GEANT4
13. 10.50-11.05 (15 мин.) **Р.Г. Усеинов, А.С. Ватюев**
АО «НИИП»
Методика расчетно-экспериментальной оценки параметров чувствительности ЭКБ к эффектам одиночных событий при воздействии нейтронов по результатам экспериментов на ТЗЧ и ВЭП
14. 11.10-11.25 (15 мин.) **Г.А. Протопопов, А.Е. Козюков, С.А. Яковлев, П.А. Чубунов**
Филиал АО «ОРКК» – «НИИ КП»
Сравнение результатов испытаний ЭКБ в сложно-корпусном исполнении при воздействии ТЗЧ с фронтальной и тыльной стороны
15. 11.30-11.45 (15 мин.) **Н.Н. Петух¹, В.А. Благодырев¹, П.Б. Галованов¹, П.Б. Лагов¹, Т.А. Максименко², А.А. Кляйн², С.А. Яковлев²**
¹АО «Российские космические системы», ²Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Устройство парирования тиристорного эффекта на отечественной электронной компонентной базе, с регулируемым порогом и временем срабатывания
16. 11.50-12.05 (15 мин.) **А.Е. Козюков, Р.П. Бабак, А.О. Волков, Н.А. Панкратова, К.С. Осипов, Т.В. Никольская**
Филиал АО «ОРКК» – «НИИ КП»
Особенности подготовки изделий ЭКБ сложного конструктивного исполнения к испытаниям на стойкость к воздействию ТЗЧ

12.10-13.00 Перерыв (кофе-брейк)

17. 13.00-13.15 (15 мин.) **Д.В. Савченков, А.Н. Цирков, А.А. Новиков**
АО «ЭНПО СПЭЛС», НИЯУ МИФИ
Автоматизация испытаний изделий ЭКБ на лазерных установках со сфокусированным излучением посредством клиент-серверного взаимодействия

18. 13.20-13.35 **В.В. Емельянов, А.В. Сиделев, А.Е. Нестеренко**
(15 мин.) АО «НИИП»
Повышение чувствительности детектора на основе МНОП-структуры с помощью оптимизации выхода заряда в SiO₂
19. 13.40-13.55 **А.А. Печенкин, Д.С. Уколов, Р.К. Можеев, А.В. Уланова**
(15 мин.) НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Особенности радиационного поведения оптических волокон при стационарном гамма воздействии в различных режимах и условиях эксплуатации
20. 14.00-14.15 **И.С. Азанова^{1,2}, А.Д. Шевцова^{1,2}, А.С. Вахрушев¹, Д.И. Нурмухаметов¹, Ю.О. Шаронова¹, И.В. Петухов^{1,2}, А.Б. Вольнецев²**
(15 мин.) ¹ПАО «ПНППК», ²Пермский государственный национальный исследовательский университет
Влияние непрерывного гамма-излучения на характеристики радиационно-стойкого активного эрбиевого оптического волокна

14.20-15.00 Перерыв (кофе-брейк)

21. 15.00-15.15 **А.С. Бакеренков, В.С. Першенков, В.А. Фелицын, А.С. Родин, В.А. Телец, В.В. Беляков, А.И. Жуков, Д.М. Арзамасцева**
(15 мин.) НИЯУ МИФИ
Исследование уровня отказа БикМОП линейного регулятора напряжения при воздействии ионизирующего излучения в широком диапазоне температур
22. 15.20-15.35 **М.П. Белова, Д.В. Печенкина, О.Ю. Винокуров, Е.Ю. Внукова**
(15 мин.) НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Эффекты мощности дозы в стабилизаторах напряжения
23. 15.40-15.55 **Д.В. Заворотнов, А.С. Колосова, М.В. Музафаров, С.А. Липатников**
(15 мин.) НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Доминирующие радиационные эффекты в преобразователях физических величин

16.00-16.30

**Дискуссия, обсуждение стендовых докладов
Предложения в Решение конференции**

Стендовые доклады

- C1 А.Е. Лебединская, В.Л. Зефилов, Ю.А. Кабальнов, А.Н. Труфанов**
Филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» НИИИС им. Ю.Е. Седакова
 Анализ эффективности иммерсионной среды оптронов на стойкость к внешним воздействующим факторам
- C2 К.О. Максимов¹, А.А. Дедюхин², В.В. Казаков³**
¹ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», ²ООО «ИРЗ ТЕСТ», ³АО «НИИП»
 Исследование пространственных характеристик тормозного излучения системы рентгеновского контроля Phoenix nanome|x 180
- C3 Е.Н. Некрасова¹, Е.В. Митин¹, А.В. Грунин², Е.А. Голихина², В.Н. Ломасов³, А.И. Лоскот⁴**
¹ООО «НПЦ «Гранат», ²ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ³ФГАОУ ВО «СПбПУ»,
⁴ВКА им. А.Ф. Можайского
 Расчет энергетических спектров гамма-излучения и мощности кермы для гамма-установки
- C4 Е.В. Митин, Д.Е. Мелешкевич**
¹ООО «НПЦ «Гранат»
 Сравнительное исследование стойкости ЭРИ к воздействию рентгеновского и гамма-излучения различной интенсивности
- C5 М.В. Анохин^{1,2,4}, В.И. Галкин^{2,4}, А.Е. Дубов^{3,4}, Л.М. Зелёный³, О.В. Морозов², Л.В. Савкин¹, И.В. Чулков³**
¹СКБ КП ИКИ РАН, ²МГУ им. М.В. Ломоносова, ³ИКИ РАН, ⁴ИТЭТ
 О физике и технике спектральной микродозиметрии
- C6 П.В. Рубанов¹, С.Е. Луконин¹, А.В. Кетько², М.М. Кречко², С.В. Шпаковский², Ю.В. Богатырев³, Д.А. Огородников³, С.Б. Ластовский³**
¹Томский политехнический университет, ²ОАО «ИНТЕГРАЛ», ³НПЦ НАН Беларуси по материаловедению
 Воздействие гамма-излучения на параметры р-канальных МОП-транзисторов
- C7 П.В. Рубанов¹, С.Е. Луконин¹, Д.А. Огородников², Ю.В. Богатырев², П.С. Ластовский³, А.В. Кетько⁴, А.М. Лемешевская⁴, В.С. Цымбал⁴**
¹Томский политехнический университет, ²НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, ³Белорусский государственный университет, ⁴ОАО «ИНТЕГРАЛ»
 Влияние альфа-частиц на ВАХ кремниевых фотоумножителей с оптической экранировкой ячеек
- C8 П.О. Черняков, А.П. Скоробогатов**
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН
 Баланс сбоеустойчивости и быстродействия при переходе от 250 нм КНИ к 65 нм объемной КМОП-технологии на примере контроллера памяти

- С9** **Е.К. Эмин, А.В. Клишин, Н.В. Желудков, А.О. Власов, А.А. Антонов, К.А. Петров**
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН
 Сравнение методов троирования для повышения сбоеустойчивости блока целочисленного умножения/деления по проектным нормам 65 нм
- С10** **Н.Н. Булгаков, В.Ф. Зинченко**
АО «Российские космические системы»
 Анализ физических процессов, приводящих к пробоем подзатворного окисла мощных МОП транзисторов при воздействии тяжелых заряженных частиц
- С11** **А.И. Кононенко, А.Г. Циканин**
АО «НИИП»
 Управление старением электрических кабелей на атомных станциях
- С12** **А.И. Кононенко, А.Г. Циканин**
АО «НИИП»
 Устойчивость кабелей к проектным авариям с потерей теплоносителя на энергоблоках с РБМ
- С13** **А.П. Метелёв**
АО «НИИП»
 Два подхода к расчёту работы секции ЛИУ
- С14** **А.П. Метелёв**
АО «НИИП»
 Магнитная электризация диэлектриков и оценка её влияния на работу водяных формирующих линий
- С15** **А.А. Федоров, Д.И. Иващенко, А.И. Абрамов, В.В. Кочергин**
АО «НИИП»
 Повышение электрической прочности вакуумной изоляции на импульсных ускорителях электронов
- С16** **А.И. Абрамов, Д.И. Иващенко, В.В. Кочергин, Т.Б. Мавлюдов, И.В. Сазонова**
АО «НИИП»
 Установка импульсного электромагнитного поля: возможности и перспективы
- С17** **А.А. Потей, А.С. Петров, В.В. Емельянов**
АО «НИИП»
 Определение относительной эффективности импульсных моделирующих установок с различными амплитудно-временными характеристиками на основе теории линейных систем
- С18** **М.В. Баньковский, М.В. Назаренко, В.М. Олухов, А.А. Потей, А.С. Петров**
АО «НИИП»
 Исследование влияния формы и длительности импульса моделирующих установок на отклик диодов с различным временем релаксации

- C19 **М.В. Назаренко**
АО «НИИП»
Особенности применения различных методов оценки ослабления падающего потока фотонов с энергией 50 кэВ
- C20 **И.А. Асанов, А.С. Петров, А.С. Ватуев**
АО «НИИП»
Влияние электрического режима при гамма-облучении на деградацию мощных МОП-транзисторов
- C21 **Ю.Ф. Жильникова, А.Д. Шорыгина, А.С. Ватуев, А.И. Озеров, В.В. Емельянов**
АО «НИИП»
Опыт использования лазерной установки PULSYS-RAD для исследований и испытаний ЭКБ на стойкость к воздействию ТЗЧ
- C22 **Р.Г. Усеинов, А.С. Ватуев**
АО «НИИП»
Методика расчетно-экспериментальной оценки параметров чувствительности ЭКБ к эффектам одиночных событий при воздействии нейтронов по результатам экспериментов на ТЗЧ и ВЭП
- C23 **Р.Г. Усеинов**
АО «НИИП»
Одиночные сбои в субмикронных ИС, индуцированные прямой ионизацией низкоэнергетичными протонами
- C24 **Р.Г. Усеинов**
АО «НИИП»
Сравнение результатов расчета спектров протонов и электронов ЕРПЗ, СКЛ и ГКЛ и локальных дозовых нагрузок с помощью различных программных средств
- C25 **А.Н. Махиня, А.А. Козлов, М.С. Петров, А.С. Ватуев**
АО «НИИП»
Особенности измерения критериальных параметров СВЧ усилителей при испытаниях на стойкость к воздействию статического ионизирующего излучения
- C26 **Б.Н. Семенец**
АО «НИИП»
Методика регистрации тиристорного эффекта и обработки данных для исследования характеристик чувствительных к воздействию ТЗЧ паразитных тиристорных структур в интегральных микросхемах
- C27 **В.В. Казаков, Д.К. Котов, П.В. Москвич**
АО «НИИП»
Исследование поля низкоэнергетического электронного излучения установки на базе стронций-иттриевого источника с целью создания эталона

- C28 **Д.К. Котов, Б.П. Мурзов**
АО «НИИП»
Влияние системы менеджмента качества в области проведения испытаний на специфическую стойкость на качество проведения и достоверность результатов испытаний. Направления развития СМК в области проведения испытаний
- C29 **О.В. Мещуров¹, Р.Г. Усеинов¹, А.Д. Артемов², В.Н. Александров², Е.О. Першина²**
¹АО «НИИП», ²АО «Корпорация «Комета»
Результаты измерения поглощенной дозы ионизирующего излучения на борту космического аппарата
- C30 **Г.А. Протопопов, А.Е. Козюков, Д.А. Казанцев, П.А. Чубунов**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Особенности задания требований по стойкости к воздействию ИИ КП по дозовым эффектам
- C31 **Г.А. Протопопов, А.Е. Козюков, С.А. Яковлев, П.А. Чубунов**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Сравнение результатов испытаний ЭКБ в сложно-корпусном исполнении при воздействии ТЗЧ с фронтальной и тыльной стороны
- C32 **П.А. Чубунов¹, А.С. Бычков¹, С.В. Митрофанов²**
¹Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП», ²ОИЯИ
Режим средних энергий на испытательном стенде контроля стойкости ЭКБ к воздействию ТЗЧ
- C33 **Г.А. Протопопов, А.Е. Козюков, Д.А. Казанцев, В.А. Холопова, С.А. Яковлев, Р.П. Бабак**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Результаты оценки максимального значения сечения насыщения одиночных радиационных эффектов по данным о площади кристалла
- C34 **Г.А. Протопопов, А.Е. Козюков, И.А. Ляхов, С.А. Яковлев**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Оценка влияния вторичных частиц на результаты испытаний ЭКБ на стойкость к воздействию ТЗЧ при облучении с обратной стороны
- C35 **Н.А. Василенков¹, А.Е. Козюков², Г.А. Протопопов², И.А. Ляхов², С.С. Грабчиков³, С.Б. Ластовский³, А.С. Якушевич³**
¹АО «Тестприбор», ²Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП», ³ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»
Результаты аналитической оценки защитных свойств специализированных защитных корпусов для снижения дозовых нагрузок на ЭКБ
- C36 **А.Е. Козюков, Р.П. Бабак, О.В. Косова, Н.А. Панкратова, П.И. Варламов, А.И. Цветков**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Методика подготовки магниторезистивной оперативной памяти для испытаний на стойкость к воздействию ТЗЧ в части одиночных радиационных эффектов

- C37 А.Е. Козюков, Р.П. Бабак, А.О. Волков, Н.А. Панкратова, К.С. Осипов, Т.В. Никольская**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
 Особенности подготовки изделий ЭКБ сложного конструктивного исполнения к испытаниям на стойкость к воздействию ТЗЧ
- C38 Е.В. Мрозовская^{1,2}, П.А. Чубунов^{1,2}, С.А. Яковлев¹, Г.И. Зебрев²**
¹*Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП», ²НИЯУ МИФИ*
 Исследование влияния температуры на сечение защелки при воздействии ТЗЧ
- C39 А.Ю. Рябцева, М.В. Шеховцов, Л.Р. Арутюнян, С.А. Яковлев**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
 Результаты испытаний ПЛИС производства КНР на стойкость к воздействию ТЗЧ
- C40 В.В. Лыков, А.Е. Козюков, С.А. Яковлев, Р.Р. Хайдаров, Т.С. Наполова, С.В. Колпачков**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
 Испытания приемопередатчиков интерфейса MIL-STD-1553 на стойкость к воздействию ТЗЧ
- C41 Р.Р. Хайдаров, Т.С. Наполова, С.В. Колпачков, В.В. Лыков, А.Ю. Рябцева, М.В. Шеховцов, Л.Р. Арутюнян, С.А. Яковлев, А.Е. Козюков**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
 Результаты испытаний аналого-цифрового преобразователя и процессора на стойкость к воздействию ТЗЧ, ВЭП и нейтронов
- C42 А.И. Цветков, А.А. Кляйн, А.Е. Козюков, С.А. Яковлев**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
 Результаты комплексных испытаний СОЗУ информационной емкостью 4МБит (512К×8бит) СУ7С1049DV33-10ZSX1 на стойкость к воздействию ТЗЧ
- C43 А.Е. Козюков, Т.А. Максименко, Н.В. Бондаренко, М.А. Тюрников, А.С. Кухарев**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
 Проблемы подготовки к испытаниям многокристалльных модулей на стойкость к воздействию ТЗЧ
- C44 Н.В. Бондаренко, М.А. Тюрников, А.С. Кухарев, Т.А. Максименко, А.Е. Козюков**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
 Сравнение результатов испытаний оптопары отечественного производства на ускорителе электронов, изотопе Co⁶⁰ и рентгеновском имитаторе
- C45 М.Ю. Выростков, К.Б. Бу-Хасан, Т.А. Максименко, Н.Г. Ильин, М.С. Мальцева**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
 Сбои функционирования биполярных стабилизаторов напряжения при воздействии ТЗЧ
- C46 Н.Г. Ильин, М.Ю. Выростков, М.С. Мальцева, К.Б. Бу-Хасан, Т.А. Максименко, А.Е. Козюков**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
 Анализ зависимости безопасных напряжений сток-исток в МОПТ от ЛПЭ

- C47 **Н.Н. Монастырев, Г.И. Зебрев**
НИЯУ МИФИ
 Новая параметризация сечений одиночных сбоев от ТЗЧ космического пространства
- C48 **С.Л. Эльяш, Т.В. Лойко, А.Л. Юрьев, А.А. Селезнев**
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
 Регистрация субнаносекундных импульсов электронного и рентгеновского излучений
- C49 **О.Г. Айтуганов, А.И. Петров, М.А. Рыбаков**
АО «НПП «Исток» им. Шокина»
 Исследование стойкости к воздействию специальных факторов инфрадиного приемного модуля СВЧ
- C50 **М.А. Болдырев, В.Ф. Герасимов, Р.А. Курьяков**
ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России
 К вопросу подтверждения стойкости плетенок гибких металлических экранирующих к воздействию специальных факторов
- C51 **А.С. Афанасьев, М.А. Болдырев, В.Ф. Герасимов**
ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России
 К вопросу подтверждения стойкости литиевых элементов и литий-ионных аккумуляторов к воздействию специальных факторов
- C52 **В.Ф. Герасимов, Р.Н. Журиков, Е.А. Старостина, А.В. Шакуров**
ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России
 К вопросу подтверждения стойкости металлокерамических корпусов к воздействию специальных факторов
- C53 **М.А. Болдырев, В.Ф. Герасимов, В.Ч. Долидзе, В.А. Соболев**
ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России
 К вопросу подтверждения стойкости электрических машин малой мощности к воздействию специальных факторов
- C54 **А.С. Бакеренков, В.С. Першенков, В.А. Фелицын, А.С. Родин, В.А. Телец, В.В. Беляков, А.И. Жуков, Д.М. Арзамасцева** *НИЯУ МИФИ*
 Исследование уровня отказа БИКМОП линейного регулятора напряжения при воздействии ионизирующего излучения в широком диапазоне температур
- C55 **А.С. Бакеренков¹, В.А. Фелицын¹, П.А. Чубунов^{1,2}, В.С. Першенков¹, А.С. Родин¹, А.И. Жуков¹, И.Д. Ковшаров¹, Д.М. Арзамасцева¹**
¹НИЯУ МИФИ, ²Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
 Оборудование для задания и контроля температуры объектов испытаний при воздействии ТЗЧ и статического ионизирующего излучения
- C56 **В.С. Першенков¹, В.В. Беляков¹, В.А. Телец², В.А. Фелицын¹, А.С. Бакеренков¹, А.С. Родин¹** *¹НИЯУ МИФИ, ²ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ*
 История развития исследований эффекта низкой интенсивности в биполярных приборах

- C57 **В.С. Фигуров**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Методы оценки радиационно-передаточных характеристик изделий, испытываемых на стойкость к воздействию импульсных ионизирующих излучений
- C58 **В.С. Фигуров**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Оценка зависимости эффективности тормозного излучения установки АРСА от расстояния до мишени установки
- C59 **В.С. Фигуров**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Отработка методики оценки соответствия заданным требованиям при ускоренных радиационных испытаниях изделий электронной техники
- C60 **Н.М. Жидков, А.Г. Кузнецов, В.В. Елесин, К.М. Амбуркин, Д.И. Сотсков, Н.А. Усачев**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Показатели радиационной стойкости СВЧ усилителей мощности на основе GaAs рНЕМТ
- C61 **В.В. Елесина, А.Г. Кузнецов, В.Н. Котов, Д.И. Сотсков, Н.А. Усачев**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Радиационно-ориентированная характеристика технологического процесса SGB25V по тиристорному эффекту
- C62 **Н.М. Жидков, Н.А. Усачев, Д.И. Сотсков, В.В. Елесин, А.Г. Кузнецов**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Универсальная радиационно-ориентированная модель SiGe гетеробиполярного транзистора
- C63 **И.А. Селищев, Д.И. Сотсков, Н.А. Усачев**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
SiGe БикМОП генератор, управляемый напряжением, для приемопередающих БИС систем связи нового поколения
- C64 **М.С. Горбунов, В.Н. Котов, А.Г. Кузнецов, И.И. Швецов-Шиловский, А.А. Смолин, А.В. Уланова, А.В. Селецкий, Н.А. Шелепин**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС», АО «НИИМЭ»
Доминирующие эффекты накопленной дозы в транзисторах А-типа 0,18 мкм КНИ КМОП технологии
- C65 **А.В. Уланова, И.И. Швецов-Шиловский, М.С. Горбунов, А.В. Селецкий, Н.А. Шелепин, Н.В. Акишина**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС», АО «НИИМЭ», ФГУП «МНИИРИП»
Влияние технологических изменений на уровень дозовой стойкости СОЗУ изготовленных по КМОП КНИ

- C66 **И.И. Швецов-Шиловский, С.Б. Шмаков**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Автоматизированная система контроля токов утечки в микросхемах памяти при дозовом воздействии
- C67 **И.И. Швецов-Шиловский, А.И. Чумаков, А.А. Печенкин, Д.В. Бобровский**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Факторы, оказывающие влияние на развитие тиристорного эффекта при воздействии однородного импульсного лазерного излучения
- C68 **А.Б. Каракозов**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Контроль выходных логических уровней при переключении выходного триггера
- C69 **А.Б. Каракозов**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Особенности контроля времени потери работоспособности микросхем процессоров с блоком power-on-reset
- C70 **В.А. Чепов, С.Б. Шмаков, И.И. Швецов-Шиловский, А.Г. Петров**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Алгоритм контроля функционирования твердотельных накопителей при воздействии стационарного ионизирующего излучения
- C71 **Р.С. Торшин, А.А. Демидов, Д.В. Бобровский, Г.С. Сорокоумов, М.О. Калашникова**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Особенность деградации параметров ЦАП строковой (string) архитектуры при воздействии поглощенной дозы
- C72 **И.О. Лоскутов, А.О. Ахметов, О.А. Калашников, Д.В. Бойченко, А.Ю. Никифоров**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Инженерная методика учета эффектов низкой интенсивности при проведении испытаний КМОП микросхем
- C73 **А.А. Смолин, А.В. Согоян, А.И. Чумаков**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Особенности задания и оценки соответствия ИС требованиям к стойкости к воздействию ТЗЧ по одиночным радиационным эффектам
- C74 **Д.О. Титовец, А.В. Согоян, Д.В. Бобровский, С.В. Колабушкин**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Исследование угловой зависимости сечения σ_s в КМОП СБИС при воздействии протонов
- C75 **Р.Е. Васькин, Г.С. Сорокоумов, А.Б. Боруздина**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Исследование стойкости блоков памяти в БИС на основе БМК к воздействию ТЗЧ

- C76 **А.Ю. Машкова, М.А. Роговая, Д.С. Костюченко**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Автоматизированный поиск неисправностей в оснастке и оборудовании при исследованиях радиационной стойкости сложно-функциональных СБИС
- C77 **Е.А. Азовцев¹, В.Ф. Герасимов³, А.Л. Лобарев¹, Д.В. Печенкина^{1,2}, П.В. Александрова¹, Г.В. Чуков^{1,2}, А.Ю. Никифоров², В.А. Телец²**
¹АО «ЭНПО СПЭЛС», ²ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ, ³ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ
 Экспериментальные исследования стойкости конденсаторов к воздействию специальных факторов
- C78 **Е.А. Азовцев¹, В.Ф. Герасимов³, А.Л. Лобарев¹, Д.В. Печенкина^{1,2}, П.В. Александрова¹, Г.В. Чуков^{1,2}, А.Ю. Никифоров², В.А. Телец²**
¹АО «ЭНПО СПЭЛС», ²ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ, ³ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ
 Экспериментальные исследования стойкости резисторов к воздействию специальных факторов
- C79 **Е.А. Азовцев¹, В.Ф. Герасимов³, А.Л. Лобарев¹, Д.В. Печенкина^{1,2}, П.В. Александрова¹, Г.В. Чуков^{1,2}, А.Ю. Никифоров², В.А. Телец²**
¹АО «ЭНПО СПЭЛС», ²ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ, ³ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ
 Экспериментальные исследования стойкости точечных изделий к воздействию специальных факторов
- C80 **Е.А. Азовцев¹, В.Ф. Герасимов³, А.Л. Лобарев¹, Д.В. Печенкина^{1,2}, П.В. Александрова¹, Г.В. Чуков^{1,2}, А.Ю. Никифоров², В.А. Телец²**
¹АО «ЭНПО СПЭЛС», ²ЦЭПЭ НИЯУ МИФИ, ³ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ
 Экспериментальные исследования стойкости коммутационных изделий к воздействию специальных факторов
- C81 **С.М. Малюченко¹, Д.И. Грицаенко¹, Е.А. Азовцев¹, Д.В. Печенкина^{1,2}, С.В. Воронин³, П.А. Баламутов³**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС», ³Госкорпорация «Росатом»
 Контроль индуктивности дросселей при воздействии импульсов ионизирующего излучения
- C82 **Е.Ю. Внукова, Д.В. Печенкина, М.П. Белова, Г.Г. Давыдов**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Радиационное поведение модуля питания при воздействии импульсов ионизирующего излучения
- C83 **Е.Ю. Внукова, М.П. Белова, Д.В. Печенкина**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Стойкость источников вторичного электропитания к воздействию накопленной дозы при различных электрических режимах
- C84 **М.В. Музафаров, А.С. Колосова, А.А. Печенкин, Г.Г. Давыдов, П.С. Громова, Д.В. Бойченко**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Стенд задания пониженной температуры на модулях Пельтье для долговременных исследований силовых полупроводниковых приборов и модулей

- C85 **А.А. Аникин, К.А. Епифанцев, П.К. Скоробогатов**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Влияние серии импульсов напряжения на диоды и транзисторы
- C86 **А.Н. Шемонаев, К.А. Епифанцев, П.К. Скоробогатов, И.И. Швецов-Шиловский, А.Ю. Никифоров**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Тиристорный эффект в КМОП СОЗУ при воздействии одиночными импульсами напряжения
- C87 **А.Н. Шемонаев, Е.В. Столярук, К.А. Епифанцев, П.К. Скоробогатов**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Определение наиболее критичного режима работы ИС при испытаниях на импульсную электрическую прочность
- C88 **А.А. Балувев, А.А. Печенкин, Р.К. Можаяев, Д.С. Уколов**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Исследование радиационно-наведенного затухания в одномодовом оптическом волокне при пониженной температуре при воздействии импульса протонов
- C89 **В.П. Лукашин, А.А. Балувев**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Исследования стойкости МФПУ к воздействию гамма-нейтронного импульса
- C90 **Д.С. Уколов¹, Р.К. Можаяев^{1,2}, А.А. Печенкин^{1,2}, С.В. Воронин³, П.А. Баламутов³**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС», ³Госкорпорация «Росатом»
 Сравнение деградации мощности излучения ИК-светодиода на основе гомоперехода при воздействии протонами и нейтронами
- C91 **А.А. Новиков, А.А. Печенкин**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Проведение исследований на лазерных установках в условиях пандемии COVID-19 и дистанционной работы
- C92 **А.Н. Цирков, Д.В. Савченков, А.А. Новиков**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Автоматизация испытаний изделий ЭКБ на лазерных установках со сфокусированным излучением посредством клиент-серверного взаимодействия
- C93 **А.Я. Борисов, А.А. Новиков, А.А. Печенкин**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Математическая обработка осциллограмм ионизационных реакций. Особенности применяемого метода
- C94 **Е.Н. Облова, А.А. Печенкин, А.А. Новиков**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Сравнительные исследования тиристорных эффектов в цифровом потенциометре при воздействии лазерного излучения с различными длинами волн

- C95 **М.М. Новикова, А.А. Новиков, А.А. Печенкин**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Методический подход для определения стойкости КМОП ИС к эффектам от воздействия ОЯЧ при пониженной температуре
- C96 **Р.К. Можаяев, Д.С. Уколов, А.А. Печенкин**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Спектрометр на основе кремниевой ПЗС-матрицы для измерения быстропротекающих изменений оптических спектров излучения
- C97 **А.Э. Мелекесов, П.В. Некрасов**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Монитор наличия гамма излучения установки «ГАММА ПАНОРАМА МИФИ»
- C98 **Н.С. Храпова, А.Д. Бабаев, П.В. Некрасов**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
 Управляемый ослабитель энергии отдельных ядерных частиц
- C99 **А.С. Якушевич¹, Н.А. Василенков², Г.А. Протопопов³, А.Е. Козюков³**
¹ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению», ²АО «Тестприбор»,
³Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
 Особенности накопления дозы от протонов ЕРПЗ в специализированном металлическом корпусе
- C100 **Н.А. Куликов¹, В.Д. Попов¹, И.А. Харитонов²**
¹НИЯУ МИФИ, ²НИУ ВШЭ
 Прогнозирование радиационных отказов КМОП ИМС при низкоинтенсивном облучении
- C101 **В.В. Гончаров, А.Н. Загорков, О.В. Михеев, А.Е. Ошкин**
АО «ГКНПЦ им М.В. Хруничева» – КБ «Салют»
 Радиационный анализ межорбитальных перелетов космических аппаратов с малой тягой, при добавлении участков перелета с выключенной электроракетной двигательной установкой
- C102 **А.Н. Панюшкин¹, Н.Н. Панюшкин², И.П. Бирюкова³, В.К. Зольников²**
¹НКТБ «Феррит», ²ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, ³Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
 Модель локальной дозовой нагрузки для сплошной защиты в форме прямоугольного параллелепипеда